



T +31 30 785 63 75
g.deiongh@vo.eu

Gijs de Iongh

Ingenieurwesen

Europäischer und Niederländischer Patentanwalt,
European Patent Litigator
Associate

Gijs de Iongh studierte Maschinenbau (Bachelor) und System- und Kontrolltechnik (Master) an der Technischen Universität Delft. Die Forschung im Rahmen seines Abschlussprojekts erfolgte im Bereich der Adaptiven Optik und insbesondere der Wellenfronttechnologie (wavefront shaping) für Lichtscheibenmikroskopie und optische Faserendoskopie. Außerhalb des Basiscurriculums folgte Gijs de Iongh Fächern im Bereich der Optik, der Signalverarbeitung und des bildgebenden Verfahrens und während seines Aufenthalts in Stockholm spezialisierte er sich auf Medizintechnik.

Berufserfahrung

- Patentanwalt, V.O. (Juni 2022)
- Patentanwaltskandidat, V.O. (November 2017)

Ausbildung

- BSc Maschinenbau, Technische Universiteit Delft
- MSc Systems & Control, Technische Universiteit Delft
- Minor, Biomedical Engineering, Royal Institute of Technology in Stockholm

Publikationen

- Dean Wilding, Gijs de Iongh, Oleg Soloviev, Paolo Pozzi, Gleb Vdovin, Michel Verhaegen, "Rapid identification of coherent pupil functions from multiple intensity measurements", Proc. SPIE 10416, Optical Coherence Imaging Techniques and Imaging in Scattering Media II, 104160G (1 August 2017);

Sprachen

- Niederländisch
- Englisch
- Deutsch(Basis)
- Französisch (Basis)
- Schwedisch(Basis)
- Spanisch(Basis)